

# Séminaire de l'axe 6 du *DIM Analytics* (Caractérisation Nanométrique)

**Vendredi 07 septembre 2012**

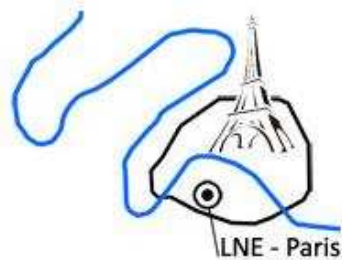
9h30 – 17h

*(Programme définitif à venir)*

## **Amphithéâtre du LNE**

1 rue Gaston Boissier  
75015 Paris

Tram T3 ou Bus 89 Arrêt  
Georges Brassens



### **1) État des lieux des besoins dans le domaine de la caractérisation nanométrique**

*(par les responsables de l'axe + invités du DIM « Des atomes froids aux nanosciences »)*

### **2) Présentation des actions en cours en Île de France sur le développement analytique lié à la caractérisation nanométrique**

*(par les partenaires du DIM Analytics)*

### **3) Discussions sur les pistes de développement prioritaires et les collaborations possibles**

#### **Contacts**

[eric.eliot@cea.fr](mailto:eric.eliot@cea.fr) / [sophie.vaslin-reimann@lne.fr](mailto:sophie.vaslin-reimann@lne.fr) / [georges.favre@lne.fr](mailto:georges.favre@lne.fr)